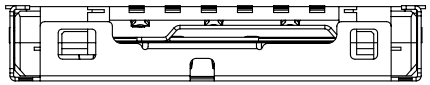
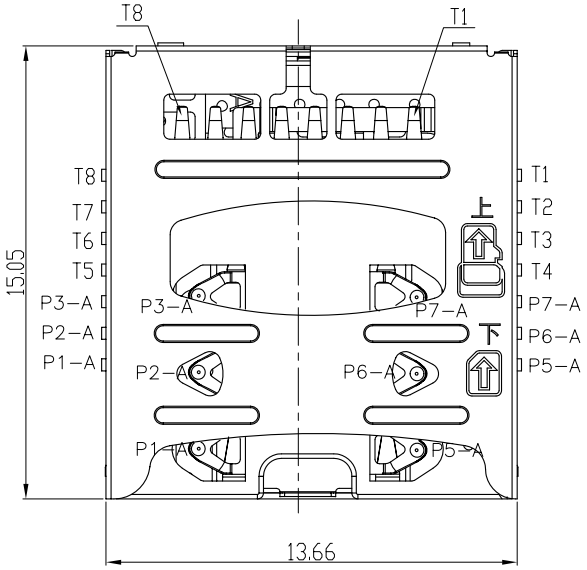
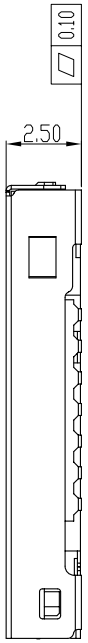
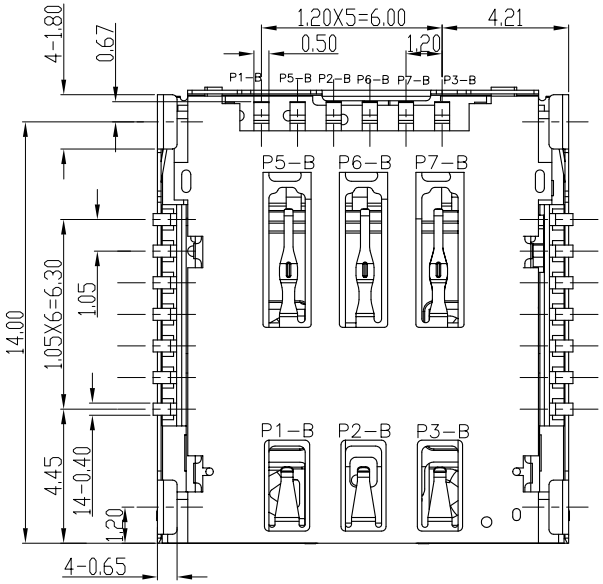
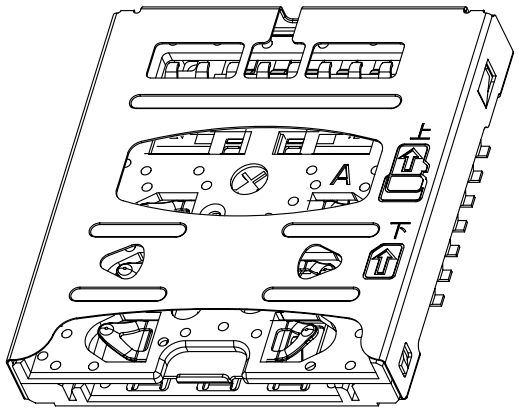
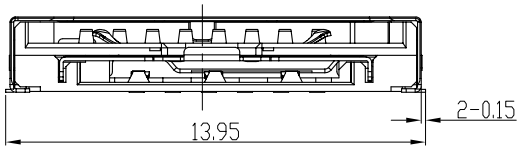












N

T-CARD P/N	PIN NAME
T1	DAT2
T2	CD/DAT3
T3	CMD
T4	VDD
T5	CLK
T6	VSS
T7	DATO
T8	DAT1

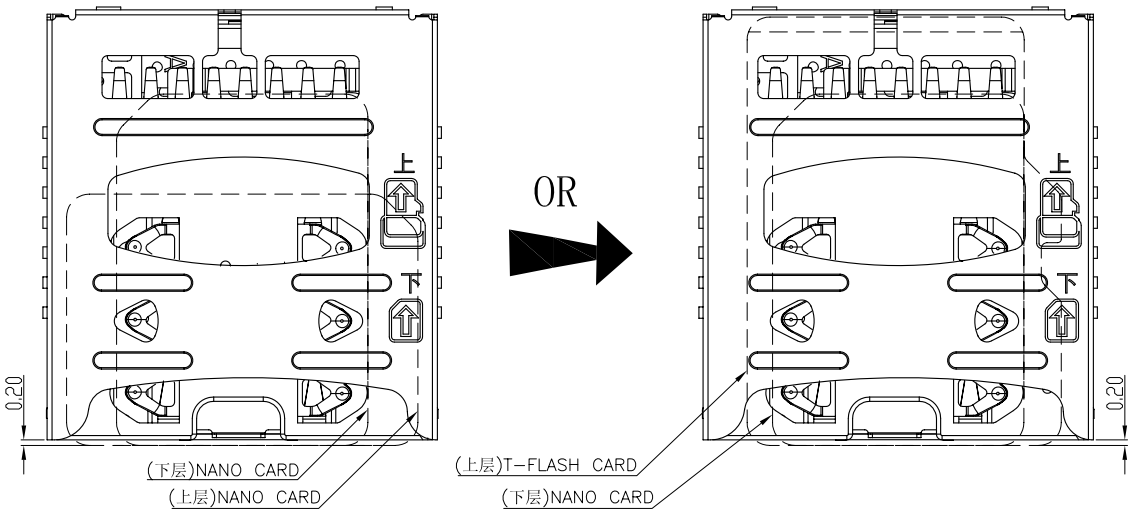
NANO SIM P/N	PIN NAME
P1 A/B	VCC
P2 A/B	RST
P3 A/B	CLK
P5 A/B	GND
P6 A/B	VPP
P7 A/B	I/0

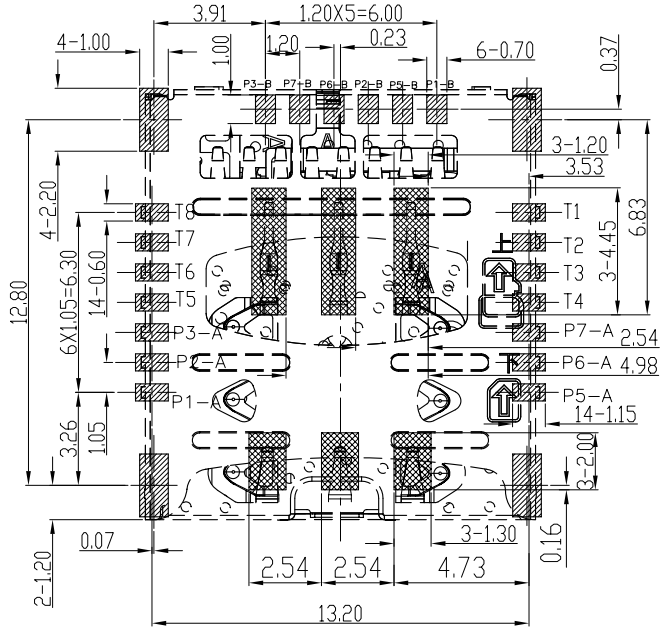
OTES:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1-1. CONTACT RESISTANCE:
60 Milliohms Max
1-2. INSULATION RESISTANCE:
1,000 Megohms Min.
1-3. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
250V AC FOR 1 MINUTE.
2. MECHANICAL CHARACTERISTICS
2-1. OPERATION TEMPERATURE RANGE:
-25°C~+70°C
2-2. DURABILITY: 3000 CYCLES
3. MATERIAL:
3-1. HOUSING: THERMOPLASTIC,UL 94-V0
3-2. TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
3-3. SHELL: STAINLESS STEEL
4. FINISHED:
4-1. TERMINAL: Ni PLATED UNDER,Au PLATED ON
CO TACT AREA F PLATED O SOLDER TAIL

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 2.5H 3选2双层卡座
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC34-3IN120-250
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱国夷	DATE : 2014-02-23	MOLD NO. / DRAW NO: HYC-SIM16120801
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

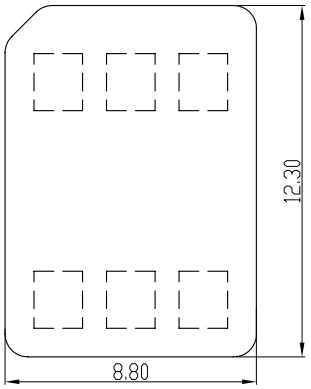




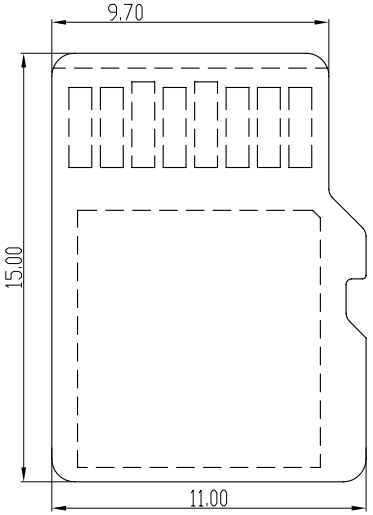
RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOLERANCE ±0.05)

RECOMMENDED METAL MASK T=0.12mm SCALE: 1:1

PAD AREA NO CIKUIT AREA (TOP VIEW)



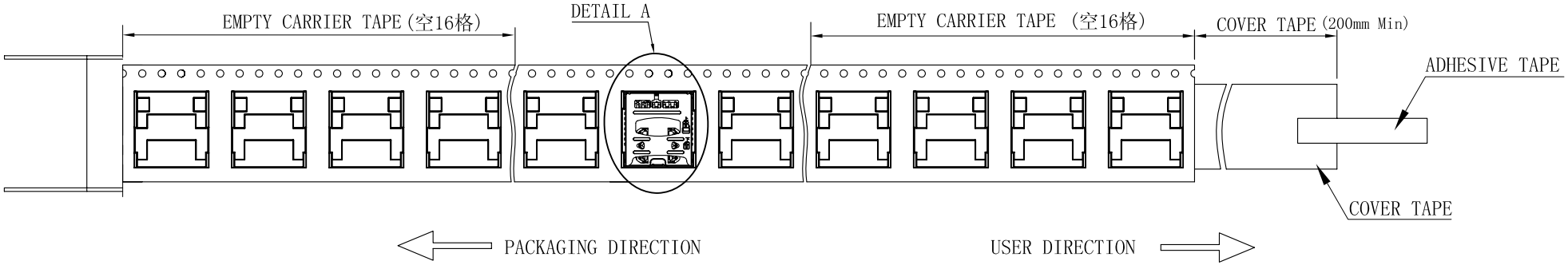
NANO SIM CARD

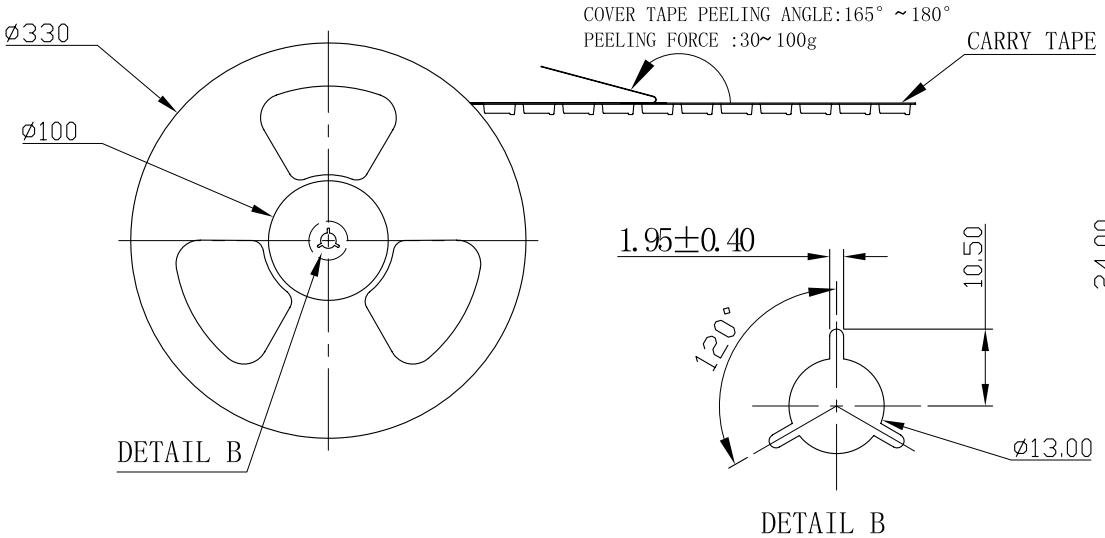


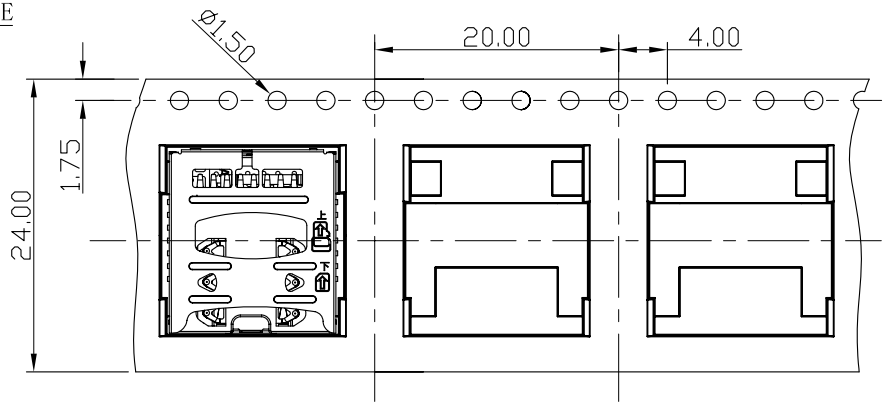
T-FLASH CARD

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 2.5H 3选2双层卡座	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC34-3IN120-250
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱国夷	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO:	HYC-SIM16120801
			SHEET NO.	1 OF 1







DETAIL A (SCALE:2:1)

1	HYC30-3IN220-250	1000	12	12000	340X340X352
ITEM	PRODUCT NO.	QTY/REEL	REEL/CARTON	QTY/CARTON	CARTON SIZE

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 包装图
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. / MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱国夷	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: / SHEET NO. 1 OF 1
SCALE:1:1	SIZE: A4		

1. Scope

This specification cover performance,test,and quality requirements for SIM CARD CONNECTOR,The product described here has not been fully tested to conform to this specification, however the performance and quality requirement will be tested accordingly to be required for application environments.

2. Sampling Requirements

2.1 Product and sampling :

Product to be tested should be conform to applicable drawing and quality inspection procedure.

Samples shall be prepared in accordance with applicable test method and fixture. Sample selected from at random production batch after the first article approval, shall be measured critical dimensions as specified, and plating thickness.

2.2 Material and finish :

Material and finish for component should be specified in applicable drawing.

2.2.1Material :

CONTACT： copper alloy

SHELL: Stainless steel

HOUSING：Hi-Temp plastic, UL94V-0, Color：Black

2.2.2Finish:

TERMINAL:Au Plated on the contact area,
and on the solder tails underplated over nickel.

SHELL: Au Plated on the solder tails underplated over nickel.

3. Standard Data

A. Operating Voltage	DC100V
B. Operating Current	1A MAX.
C. Temperature	-40 °C … +85 °C
D. Humidity	80%

4. performance test requirement and procedures

Product designed to meet electrical, mechanical, and environmental requirement specified here in below table. The test items denotes (*) shall be performed priority, however other items may be tested accordingly required by specific application required.

4.1 Examination of product (Outward Appearance Structure

Shall be confirmd with eyes in accordance with each drawing.

1).a.Outward appearance shall be good without such injurious problem

b. Shall be confirmed by using proper measuring instruments.

2).Structure shall be meet the design and dimensional requirements of drawing.

4.2 Electrical performance :

No	Item	Test method	Requirement
4.2.1	Contact Resistance	Mesured by low level (Max. 20mV,1mA)	60mΩ Max.(first)
4.2.2	Dielectric Withstanding Voltage	250V AC rms for 1 minute between adjacent contact and shell	No shortcircuiting and damage
4.2.3	Insulation Resistance	D.C 500V is applied between adjacent contacts and Insulation Resistance is measured within one minute.	1000 MΩ Min.(first)

4.3 Mechanical Performance :

No	Item	Test method	Requirement
4.3.1	Contact Retention Force	Measured by means of tensile force test equipment	80g Min.
4.3.2	Durability	5000 cycles of inserting and separating actions are conducted	Contact Resistance:50 mΩ Max.

4.4 Environment Performance :

4.4.1	Heat Withstanding	-55˚C(30min) to +25˚C(5min) consecutive 5 cycles.	There shall be no shortcircuiting and damage detected at AC 250V r.m.s for one minute.Insulation resistance shall be 100MΩ Min.(final) Contact Resistance shall be 100mΩ Max.(final)
4.4.2	Humidity	Temperature:40˚C,Time:96hours Relative Humidity:90～95%	
4.4.3	Salt Spray	Salt water density of 5%,35˚C for 48hours	There shall be no exposure of base metal of contact. Contact resistance : 100 mΩ Max.
4.4.4	Solderability	The end of the post shall be dipped in a solder bath at 250±5˚C for 10±0.5 sec.	More than 95% of the dipped part shall be covered with solder

4.5 Test Sequence Group

\No	Test Description	Grp1	Grp2	Grp3	Grp4	Grp5	Grp6	Grp7
1	Examination of product	①⑦	①⑤	①⑥	①⑦	①⑦	①⑤	①③
2	Contact Resistance	②	②④	②⑤	②⑤	②⑤	②④	
3	Dielectric Withstanding Voltage		③					
4	Insulation Resistance	③			③⑥	③⑥		
5	Mating Force	④						
6	Unmating Force	⑤						
7	Contact Retention Force	⑥		④				
8	Durability			③				
9	Heat Withstanding				④			
10	Humidity					④		
11	Salt spray						③	
12	Solderability							②
13	Sample size	5	5	5	5	5	5	5

深圳市華宇創精密電子有限公司

SHENZHEN HOAUC PRECISIONSS ELECTRONS CO.,LTD

可焊性測試報告

報告編號：20171002002

送檢部門	開發部	送样日期	2017-10-2
產品名稱/料号	NANOSIM+TF卡座2.5H 3选2双层卡座 HYC34-3IN120-250	完成日期	2017-10-7
產品數量	5pcs	測試儀器	無鉛錫爐
產品類型	成品	測試項目	可焊性測試

1、測試目的：	①、評估端子電鍍后，經焊錫性測試是否存在拒焊、針孔等品質異常現象 ②、評估端子的可焊面積是否能達到95%以上	
2、測试依据（工程規格書）	Test method	Requirement
	The solder tails shall be dipped in a solder bath at 235±5℃ for3±0.5sec.	More than 95%of the dipped par t shall be covered with solder
3、測試條件：	設置錫爐的溫度為（250±5）℃，以3±0.5（inch)/S的浸泡速度浸泡(3-5)S	
4、判定標準：	焊锡面积达95%以上	

產品	測試記錄	判定
①	无假焊、空焊不良，上锡性良好	OK
②	无假焊、空焊不良，上锡性良好	OK
③	无假焊、空焊不良，上锡性良好	OK
④	无假焊、空焊不良，上锡性良好	OK
⑤	无假焊、空焊不良，上锡性良好	OK
備注		
综合判定	合格	

核准：Choice　　測试：黄艳霞

深圳市華宇創精密電子有限公司

SHENZHEN HOAUC PRECISIONSS ELECTRONS CO.,LTD

絕緣阻抗測試報告

報告編號：20171002002

送樣部門	開發部	送样日期	2017-10-2
產品名稱/料号	NANOSIM+TF卡座2.5H 3选2双层卡座 HYC34-3IN120-250	完成日期	2017-10-7
產品數量	5pcs	測試儀器	絕緣阻抗測試儀
產品類型	成品	測試項目	絕緣阻抗測試

1、測試目的：	評估連接器或同軸端子之絕緣材料在通過直流電壓后，其表面產生漏電流的大小情況	
2、測試依據（工程規格書）	Test method	Requirement
	DC 250V is applide between adjacent contacts and Insulation Risistance is measured within one minute	1000MΩ/Min（first)
3、測試程序：	①、連接器的測試點為距離最近的兩根端子，或端子與鐵殼，若為同軸連接器則為內部與外部之端子 ②、當有多組測試數據事，取其最小值的那組 ③、在規定的電壓下，測試過程中無塑膠擊穿，電火花等品質異常現象	
4、判定標準：	1000MΩ/Min	

產品	測試記錄	判定
①	Pass	OK
②	Pass	OK
③	Pass	OK
④	Pass	OK
⑤	Pass	OK
備注		
综合判定	合格	

核准：Choice　　測试：黄艳霞

深圳市華宇創精密電子有限公司

SHENZHEN HOAUC PRECISIONSS ELECTRONS CO.,LTD

接觸阻抗測試報告

報告編號：20171002002

送樣部門	開發部	送样日期	2017-10-2
產品名稱/料号	NANOSIM+TF卡座2.5H 3选2双层卡座 HYC34-3IN120-250	完成日期	2017-10-7
產品數量	5pcs	測試儀器	接觸阻抗測試儀
產品類型	成品	測試項目	接觸阻抗測試

1、測試目的：	驗證連接器在通過電流的情況下，端子的接觸阻抗（其測試值包含端子本身之阻值）是否符合客戶的品質要求	
2、測試依据：(工程規格書)	Test method	Requirement
	Mesured by low level (Max.20mV,1mA)	60mΩ Maximum(initial)
3、測試方法：	將公母連接器結合在一起，并將公母連接器的端子串聯成以回路，回路上通過以測試電流，測試端子兩端之微小電壓降，即得其阻抗值	
4、注意事項：	測試前首先確認其回路是導通而非開路狀態，測試電阻時保持產品部受震動	
5、判定標準：	60mΩ/Max	
6、測試時間：	60s	

產品	測試記錄(mΩ)	判定
①	26、23、21、25、25、24、22、23、28、25、24、22、23、28、24、22、24、21、20、23、28、24	OK
②	25、25、24、22、23、28、24、22、24、21、21、24、22、23、28、24、22、24、22、24、21、21	OK
③	25、25、24、22、23、28、24、22、24、21、21、24、22、23、28、25、24、22、23、28、24、22	OK
④	24、22、23、28、24、22、24、21、21、24、22、22、23、28、24、22、24、21、21、24、22、23	OK
⑤	22、23、28、24、22、24、21、21、24、22、23、28、24、22、24、22、24、21、22、23、28、24	OK
備注		
最终结论	合格	

核准：Choice　　測试：黄艳霞

深圳市華宇創精密電子有限公司

SHENZHEN HOAUC PRECISIONSS ELECTRONS CO.,LTD

過IR爐高温測試

報告編號：20171002002

送檢部門	開發部	送样日期	2017-10-2
產品名稱/料号	NANOSIM+TF卡座2.5H 3选2双层卡座 HYC34-3IN120-250	完成日期	2017-10-7
產品數量	5pcs	測試儀器	IR爐
產品類型	成品	測試項目	過IR爐高溫測試

1、測試目的：	①、評估連接器曝露在高溫環境與規定的時間后端子及塑膠應力是否有馳緩現象 ②、高溫后其他異常現象影響產品品質因素
2、測試依據：	工程規格書
3、測試儀器：	IR爐
4、測試要求：	①、測試前產品外觀OK、端子無變形、翹曲、塑膠無起泡等品質異常現象 ②、將IR爐設定指定測試標準溫度250℃（±5℃），測試時間為10秒
5、判定標準：	①、測試后產品外觀OK、端子無變形、翹曲、塑膠無起泡等品質異常現象 ②、平面度≤0.08mm

產品	測試記錄					判定
	外觀(OK或NG)	變形(OK或NG)	翹曲(OK或NG)	起泡(OK或NG)	平面度	
①	OK	OK	OK	OK	≤0.08mm	OK
②	OK	OK	OK	OK	≤0.08mm	OK
③	OK	OK	OK	OK	≤0.08mm	OK
④	OK	OK	OK	OK	≤0.08mm	OK
⑤	OK	OK	OK	OK	≤0.08mm	OK
備注						
综合判定	合格					

核准：Choice　　測试：黄艳霞

深圳市華宇創精密電子有限公司

SHENZHEN HOAUC PRECISIONSS ELECTRONS CO.,LTD

鹽霧測試報告

報告編號：20171002002

送間部門	開發部	送样日期	2017-10-2
產品名稱/料号	NANOSIM+TF卡座2.5H 3选2双层卡座 HYC34-3IN120-250	完成日期	2017-10-7
產品數量	5pcs	測試儀器	鹽霧測試儀
產品類型	成品	測試項目	鹽霧測試

測試參數：

1、測試箱內溫度：35±2℃	6、溶液PH值：6.5-7.2
2、飽和桶內溫度：47±2℃	7、噴霧平均沉降量：1.0-2.0ML/80CM
3、噴霧壓力：0.7-1.0Kg/C㎡	8、乾燥溫度：80℃
4、壓縮空氣壓力：2.4Kg/C㎡	9、乾燥時間：30分钟
5、溶液比例/種類：5±0.5%NaCl	10、測試時長：24小时

測試步驟：

1、對外觀進行檢查及必要的清洗

2、按測試要求將樣品放入測試箱內

3、設定測試溫度及時間

4、測試時，當溫度達到測試所要求觀察是否連續噴霧并調整噴霧壓力等參數使之達到要求

5、測試到時后取出產品，用流動的水對測試產品沖洗5分鐘后用蒸餾水漂洗，再進行乾燥

測試依據（工程規格書）	Test method	Requirement
	Salt water density of 5%, 35℃ f 24hours	There shall be no exposure of base metal of ba se metal of contact Contact resistance:60mΩ/Max

判定標準：按測試標準時間取出產品，無起泡、氧化、生銹等腐蚀現象
接觸阻抗值為60mΩ/Max

產品	測試記錄		判定
	外觀	最大接觸阻抗值mΩ	
①	OK	56	OK
②	OK	58	OK
③	OK	52	OK
④	OK	63	OK
⑤	OK	58	OK

測試結果:	产品经24小时盐雾测试無起泡、氧化、生銹等腐蚀現象；接触阻抗值OK
備注	
综合判定	合格

核准: Choice　　測试：黄艳霞

深圳市華宇創精密電子有限公司

SHENZHEN HOAUC PRECISIONSS ELECTRONS CO.,LTD

寿命測試報告

報告編號：20171002002

送檢部門	開發部	送樣日期	2017-10-2
產品名稱/料号	NANOSIM+TF卡座2.5H 3选2双层卡座 HYC34-3IN120-250	完成日期	2017-10-7
產品數量	5pcs	測試儀器	插拔力測試儀
產品類型	成品	測試項目	插拔力及壽命測試

插拔壽命測試前：

1、測試目的：	①、評估SIM卡在不同的環境壓力下，測試前與后側整體接触电阻值 ②、評估SIM卡保護蓋之防護能力
2、注意事項：	測試pin或blade时、要求其符合品质规范
3、測試依據：	工程規格書
4、測試方法：	①、將卡座焊接在PCB板上，再打开卡座的盖子， ②、将SIM卡放入，然后关闭盖子，循环3000次。
5、判定标准：	①、彈片是否變形、損壞等品質異常現象 ②、接觸阻抗值；60mΩMax(寿命前)

產品	測試記錄		判定
	外觀	接触电阻（mΩMax）	
①	OK	27	OK
②	OK	21	OK
③	OK	24	OK
④	OK	26	OK
⑤	OK	24	OK

3000次插拔壽命測試后：

	Test method	Requirement
測試依據： （工程規格書）	3000 cycles of inserting and separat ing actions are conducted Actionspeed Under500 cycles/hour	(1)、Initial:60mΩ/Max.(Initial) (2)、After test:60mΩ/Max (3)、No crack or damage
判定標準：	①、彈片是否變形、損壞等品質異常現象 ②、接触电阻60mΩMax(寿命后)	

產品	測試記錄		判定
	外觀	接触电阻（mΩMax）	
①	OK	54	OK
②	OK	55	OK
③	OK	56	OK
④	OK	54	OK
⑤	OK	57	OK

備注	
综合判定	合格

核准：Choice　　測试：黄艳霞

深圳市華宇創精密電子有限公司

SHENZHEN HOAUC PRECISIONSS ELECTRONS CO.,LTD

耐電壓測試報告

報告編號：20171002002

送樣部門	開發部	送样日期	2017-10-2
產品名稱/料号	NANOSIM+TF卡座2.5H 3选2双层卡座 HYC34-3IN120-250	完成日期	2017-10-7
產品數量	5pcs	測試儀器	耐電壓測試儀
產品類型	成品	測試項目	耐電壓測試

1、測試目的：	①、評估連接器值安全額定電壓及承受瞬間脉衝電壓之安全性評估 ②、評估連接器的絕緣材料與其組成絕緣間隔是否適當	
2、測试依据： （工程規格書）	Test method	Requirement
	250V AC for 1minute between adiacent comtact	(1)、No Flashover or insulation breakdown (2)、Leakage current:1mA/Max
2、測試方法：	①、測試點為最接近的相鄰兩端子，及鐵殼與最接近鐵殼的端子間 ②、測試時間：一分鐘 ③、耐壓過程中電流除特別規定外，一般以1mA為測試要求	
3、注意事項：	耐壓測試為高壓測試項目，故在測試時需特別小心	
4、判定標準：	设定电压250V/AC、测试过程中无电火花、击穿等品质异常现象	

測試電壓：	250vAC	測試溫度：	25℃
測試電流：	1mA	測試濕度：	60%
測試時間：	60s	測試單位：	V

產品	測試記錄	判定
①	Pass	OK
②	Pass	OK
③	Pass	OK
④	Pass	OK
⑤	Pass	OK
備注	產品經250V/AC測試均無電火花、基座擊穿等品質異常現象	
综合判定	合格	

核准：Choice　　測试：黄艳霞